

群馬産業技術センターにおける 材料分析解析技術

先端機器分析技術による材料開発&問題解決支援、
クレーム対策支援を行っております。

Move Technology Forward



TEL:027-290-3030(代表)
Mail : git@tec-lab.pref.gunma.jp
担当：材料解析係
環境・エネルギー係

○X線分析や赤外・ラマン分光分析法を用いた工業材料・製品の微小異物・欠陥部分析や化合物分布状態解析



波長分散型電子線マイクロアナライザー
島津製作所社 EPMA-1600



顕微ラマン分光分析装置
ThermoFisher Scientific社
Almega



赤外分光イメージングシステム
Bruker Optics社
Vertex70 + Hyperion3000

○表面分析法を用いたナノメートルスケール厚表面の解析、深さ方向分析、イメージング解析による
各種材料の表面機能発現機構解析、表面汚染と製品信頼性解析



飛行時間型二次イオン質量分析装置 (TOF-SIMS)
アルバック・ファイ社 PHI nano TOF



X線光電子分光分析装置 (XPS)
ThermoFisher Scientific社 Theta Probe



微小部蛍光X線分析装置 (XRF)
島津製作所社 XRF-1700

○クロマトグラフ分離・質量分析法を用いた樹脂中、塗料中の添加剤分析、樹脂劣化生成物、微量付着油分、
顔料・染料等の組成解析



ヘッドスペースガスクロマトグラフ質量分析装置
Agilent社 GC-MS



大気圧直接イオン化質量分析装置
Waterst社 LCT Premier XE / ACQUITY UPLC System

○その他、水溶液中の金属イオンの定量分析、X線回折分析、熱分析など試料や目的に合わせて、
多くの分析手法がございます。詳細につきましては、下記までお問い合わせ下さい。

群馬産業技術センター 材料解析係
〒379-2147 群馬県前橋市亀里町884-1
TEL 027-290-3030